

APPAREIL DE MÉTROLOGIE OPTIQUE ALTISURF 500

L'appareil de métrologie optique ALTISURF® 500 permet d'étudier finement la topographie de surface des échantillons d'essai.

Il représente un outil performant dans l'établissement de relations entre les états de surface, micro dimensions, revêtement... et la fonctionnalisation ou les qualités attendues d'un produit.

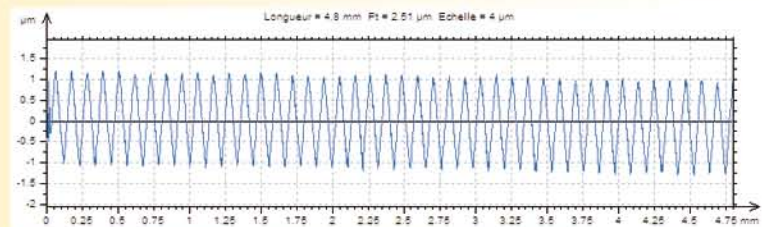


Caractéristiques et descriptif du matériel

- Plateforme de métrologie modulaire 100 x 100 x 100 mm
- Deux sondes confocales chromatiques.
Gamme de mesure : 1,1 mm et 300 μm
- Précision de déplacement de la plate forme $\approx 0,7\mu\text{m}/100\text{mm}$
- Spécification type : 2nm/mm, sigma/step inf. 3nm
- Vitesse de déplacement et pas de mesure réglables
- Camera CCD haute définition pour définir les zones de mesure
- Poids maximal des échantillons : 10kg

Prestations proposées

- Profils 2D ou topographie 3D
- Rugosités de surface Ra, Rz, Rv, Rp ...
- Porosités
- Etude de corrosion
- Comptage d'éclat suite à grenailage
- Mesure de planéité
- Saut de marche
- Mesure de profondeur de gravage
- Mesure d'épaisseur sur revêtement non opaque

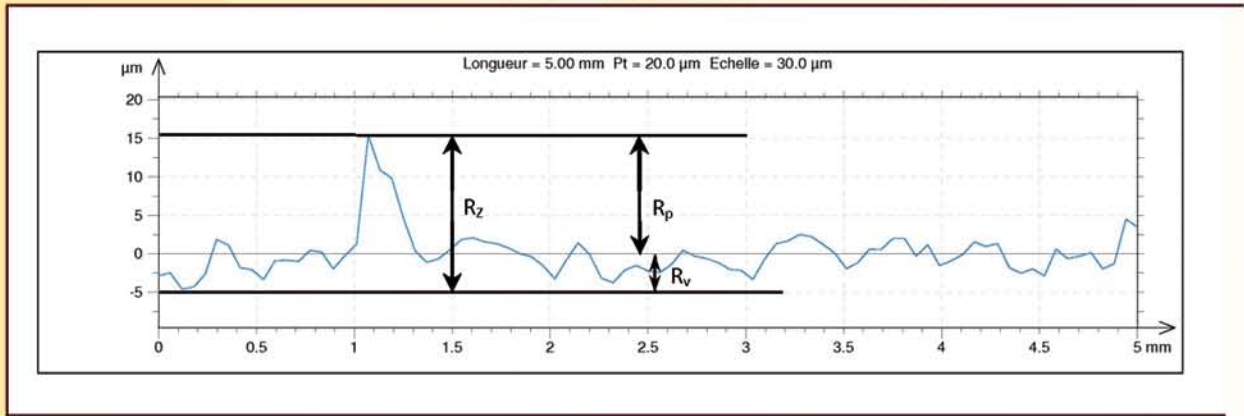


Ra=0.614 μm

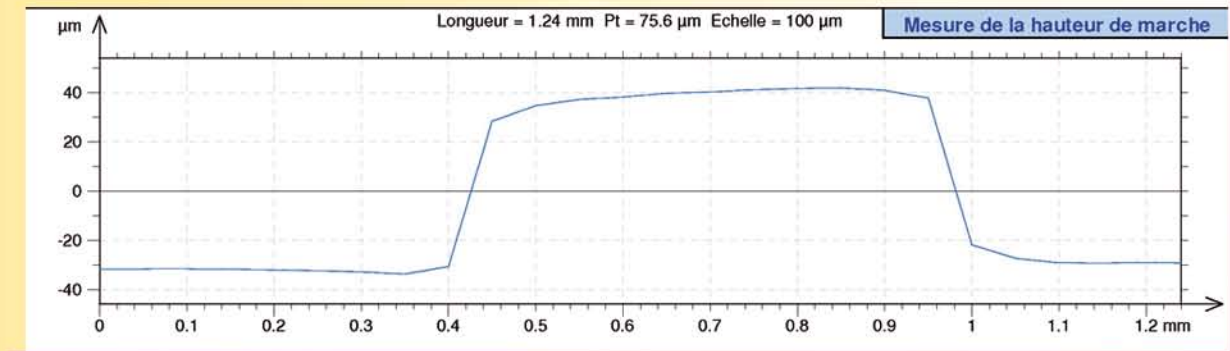
Profil de rugosité sur un étalon en verre

Exemples d'application

RELEVÉ DE PROFIL

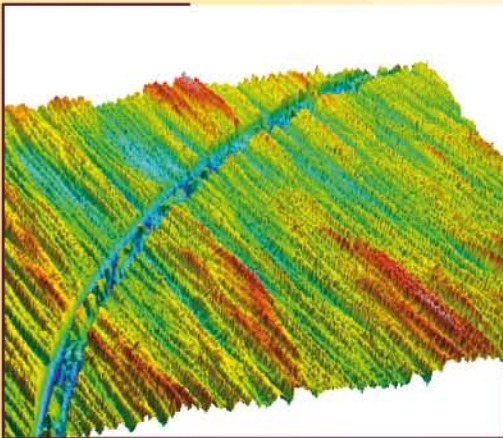


HAUTEUR DE MARCHE

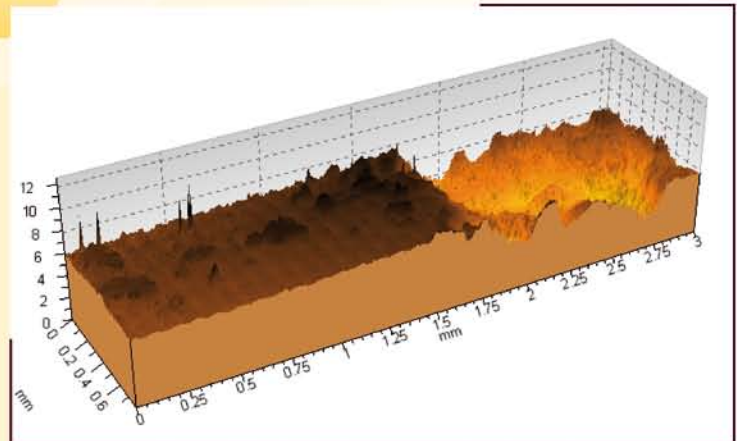


ANALYSE TOPOGRAPHIQUE 3D

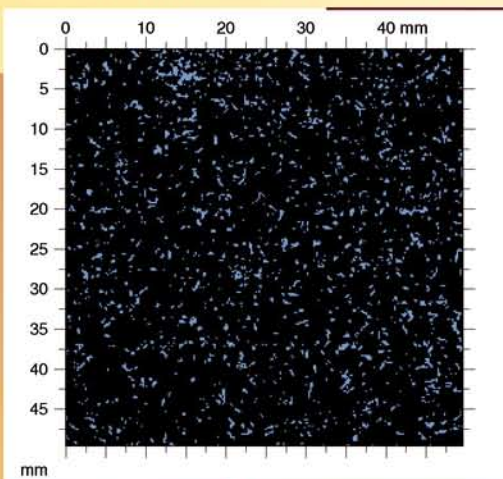
SILLON D'USURE APRÈS FROTTEMENT



FRETING CORROSION SUR COL DE TIGE FÉMORALE EN TITANE APRÈS ESSAI DE FATIGUE



COMPTAGE D'ÉCLATS SUITE À GRENAILLAGE



POROSITÉ SUR UN ÉCHANTILLON FRITÉ

